

Naziv opreme: Skenirajući elektronski mikroskop (SEM)

Model, oznaka, zemlja Tescan, MIRA\\LMU, Češka

proizvodnje:

Godina proizvodnje: 2009.

Fotografija:



Namjena: SEM mikroskopi omogućavaju istraživanje mikrostrukture nevidljivih ljudskom oku uvećanjem i do 1.000.000 puta.

Tehničke karakteristike: Razlučivost: 1.0-3.0 nm
Uvećanje: 4x-1.000.000 x
Elektronski pištolj: Schottky emiter visokog sjaja
Karakteristike skeniranja: dinamični fokus, točka & crta sken, 3D svjetlosni snop
Kontrola: PC kontrola preko programa Mira TC, Win OS
Automatska procedura: In-Flight Beam Tracing™, EasySEM™, Wide Field Optics™

Metoda/način rada: Pažljivo pripremljeni uzorak postavlja se u komoru mikroskopa. Usko usmjereni snop elektrona pada na površinu uzorka pri čemu se reflektiraju elektroni visoke energije koji se prikazuju kao varijacija svjetline na katodnoj cijevi (CRT).

Zavod, soba i lokacija: Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju, SEM laboratorij, Savska cesta 16/9